

投资者关系：  
Ed Lockwood  
投资者关系高级总监  
(408) 875-9529  
[ed.lockwood@kla-tencor.com](mailto:ed.lockwood@kla-tencor.com)

媒体关系：  
Meggan Powers  
企业宣传高级总监  
(408) 875-8733  
[meggan.powers@kla-tencor.com](mailto:meggan.powers@kla-tencor.com)

## KLA-TENCOR 推出 KLARITY® LED 缺陷分析系统和 ICOS® WI-2220 LED 晶圆检测仪来帮助制造商降低成本

KLA-Tencor 推出旨在提升 LED 设备代工厂产能的多种制程控制解决方案

- 新的 **KLARITY LED** 为 LED 成品率改善和更快取得结果提供自动缺陷分析
- 新的 **ICOS WI-2220** 提供更高的拥有成本，以支持 LED 产业的每流明成本目标

**【加州 MILPITAS 2011 年 1 月 20 日讯】**今天，专为半导体和相关产业提供制程控制与成品率管理解决方案的全球领先供应商 [KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）推出了用于改善发光二极管 (LED) 成品率的自动分析与缺陷数据管理系统——KLARITY® LED，以及专为 LED 缺陷检测而设计，帮助 LED 设备制造商降低其生产成本，同时增加 LED 设备可靠性的晶圆检测工具——新的、可扩展的 ICOS® WI-2220。

KLA-Tencor 的成长与新兴市场集团副总裁 Jeff Donnelly 称：“业界目前普遍预计，LED 市场在 2013 年前将以 25% 或更高的复合年增长率保持增长。如今，LED 设备制造商面临着以更低成本提供更高性能的挑战，同时还要支持这个产业咄咄逼人的增长率。KLA-Tencor 全面的系列 LED 缺陷检测与分析解决方案旨在为 LED 生产降低每流明成本，同时实现更严格的制程控制和总体成品率改善。”

### **KLARITY LED：用于改善 LED 成品率的缺陷分析与数据管理系统**

新的 KLARITY LED 建立在集成电路制造中使用的业界领先的 KLARITY Defect 产品基础之上，能够为 LED 设备制造商提供高性能解决方案，包括用于整个代工厂生产流程的自动线内扫描分析。LED 产业从传统的以工具为中心的人工缺陷检查开始起步（当时只在生产线终端阶段才有自动光学检测），正朝着采用尖端的全厂制程控制与线内检测缺陷分析的方向发展。由于前端与后端相互连通，KLARITY LED 提供了比业界常用方法更快的偏移侦测与根源分析，以实现有效的决策制定，从而帮助降低材料风险的影响，并改善成品率。凭借 KLARITY LED，KLA-Tencor 向 LED 设备制造商推出了先进的线内替代解决方案，以实现 LED 生产流程的自动缺陷分析，并让他们可以选择更高效地在其组织内分享性能与可靠性数据，以加快成品率学习，同时取代了现行的劳动密集型人工报告生成方法。

KLARITY LED 旨在帮助 LED 设备制造商加快成品率学习周期，并推动采取立即校正措施，它包括：

- 自动分析（智能统计制程控制偏移与基线监测）——不再像以前那样必需专家介入和解释，而是以自动情况报告、广泛的深入分析能力和实用决策流分析，为更快的校正措施提供支持

（待续）

KLA-TENCOR 推出 KLARITY® LED 和 ICOS® WI-2220 LED 晶圆检测仪

- 先进的缺陷来源分析 — 针对缺陷来源自动执行根源分析程序，为常见和附加缺陷提供灵活的图形分析
- 专有的空间特征分析 — 识别空间特征，追踪动态特征计数，并借助层积晶圆特征来查找根源，以更快地完成侦测与校正措施
- 缺陷图像检查 — 提供晶圆图点选式访问以及一个图像库，让设备制造商能够对分类与缺陷过渡共性识别进行验证，并迅速生成自动报告
- 重复缺陷侦测 — 在单个晶圆以及各个晶圆上查找重复缺陷

KLARITY LED 让 KLA-Tencor 的晶圆检测系统更加完备，包括新的 ICOS WI-2220，为关键 LED 检测投资提供了更强大的针对 LED 的一系列解决方案。

### **ICOS WI-2220: LED 制程控制中的可扩展缺陷检测与改善的拥有成本**

ICOS WI-2220 的自动光学检测功能可以帮助 LED 设备制造商提高成品率，并降低生产成本。利用 ICOS WI-2220，设备制造商可以对难以进行人工检测的较小尺寸晶粒和需要快速校正措施以限制昂贵的材料风险的更大尺寸晶粒进行自动检测。新系统允许对高达 200mm 的完整的和已切割的晶圆进行缺陷检测，并且在 LED 晶圆的切割前和切割后检测（即前端和后端）中具备宏观检测灵敏度。

与当今市场上的类似产品相比，ICOS WI-2220 提供了对关键缺陷的灵敏度——同时将由于制程变化带来的噪声降到最低——并以极高的检测速度提供了较为突出的和损害较小的性能（晶粒误分类）。此外，由于新系统采用新的专有检测与数据处理技术，因此其图像失真度低，光学过滤技术先进，采取基于规则的分类 (RBB) 进行实时自动缺陷分类，量测功能先进，并且检测吞吐量高。通过成品率基线改善、偏移控制以及输出质量控制检测中的改进配置，这使提高制造流程中的成品率成为现实。

ICOS WI-2220 与 Candela LED 非图形成像晶圆检测系统相配合，可以为前沿产品线提供全面的、改善成品率的检测范围，包括分析配置、降低缺陷和控制偏移。另外，ICOS WI-2220 还可以升级到 [ICOS WI-2250](#)，以获得更灵活的配置。

KLA-Tencor 的 ICOS WI-Series 晶圆检测仪的全套 LED 系列产品、新的 KLARITY LED 成品率管理系统和 Candela 系统将在 2011 年韩国国际 LED 展览会 (LED Korea 2011) 上展出，该展会将于 2011 年 1 月 26~28 日在首尔 Coex 国际会展中心与韩国半导体工业技术展览会 (Semicon Korea) 联合举办。所有设备均由 KLA-Tencor 的全球综合服务网络提供支持。若要了解更多信息，请访问 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com)。

**关于 KLA-Tencor:** KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与度量技术。这些技术为半导体、数据存储、LED、光伏及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，三十余年来为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州 Milpitas，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com)。(KLAC-P)

**前瞻性声明:**

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 KLARITY LED、ICOS WI-2220 和 Candela 系统的预期性能，高亮度发光二极管产业的未来发展与趋势，包括预期增长率和制程控制与缺陷分析技术的变化（及其带来的预期挑战与成本），KLA-Tencor 的客户对 KLARITY LED、ICOS WI-2220 和 Candela 系统的预期使用，以及 KLARITY LED、ICOS WI-2220 和 Candela 系统用户可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品或其他技术，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，因此实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###